PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-194060

(43)Date of publication of application: 21.07.1999

(51)Int.Cl.

G01L 9/04

(21)Application number: 10-163882

10-163882 11.06.1998 (71)Applicant:

DENSO CORP

(72)Inventor:

KOGA KAZUHIKO BABA HIRONOBU

TOYODA INEO

(30)Priority

(22)Date of filing:

Priority number: 09304531

Priority date: 06.11.1997

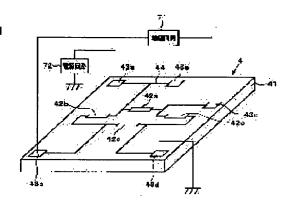
Priority country: JP

(54) PRESSURE SENSOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce the fluctuation of the outputs of sensors caused by the high-frequency noise entering the sensors from the parts of the sensors to which a pressure sensor is attached.

SOLUTION: In a pressure sensor which is constituted by fixing a sensor chip 4 to a thin-walled section constituting the diaphragm of a sensing body having a pressure introducing hole through low-melting-point glass, the potential at a silicon substrate 41 constituting the sensor chip 4 is fixed at the power supply voltage of a power source circuit 72 so that the P-N junctions between the substrate 41 and strain gauges 42a-42d may be biased reversely.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

02.07.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-194060

(43) 公開日 平成11年(1999) 7月21日

(51) Int. C1. 6 G01L 9/04 識別記号 101 F I G01L 9/04

101

審査請求 未請求 請求項の数3 〇L (全7頁)

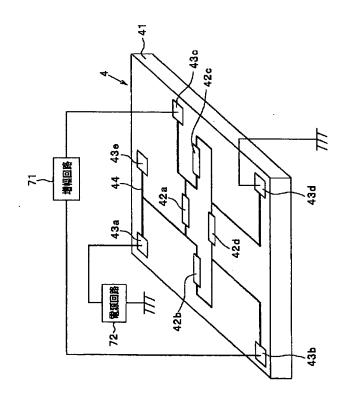
(21) 出願番号 特願平10-163882 (71) 出願人 000004260 株式会社デンソー (22) 出願日 平成10年(1998)6月11日 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 (72) 発明者 古賀 和彦 (31) 優先権主張番号 特願平9-304531 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会 (32) 優先日 平9 (1997) 11月6日 社デンソー内 (33) 優先権主張国 日本(JP) (72) 発明者 馬場 広伸 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会 社デンソー内 (72) 発明者 豊田 稲男 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会 社デンソー内 (74)代理人 弁理士 伊藤 洋二 (外1名)

(54) 【発明の名称】圧力検出装置

(57) 【要約】

【課題】 圧力検出装置を取り付ける部位から侵入する 高周波ノイズによるセンサ出力の変動を低減する。

【解決手段】 圧力導入孔を有するセンシングボディのダイヤフラムをなす薄肉部に低融点ガラスを介してセンサチップ4を固定した構造の圧力検出装置において、センサチップ4を構成するシリコン基板41の電位を電源回路72の電源電圧に固定して、シリコン基板41と歪ゲージ42a~42dとの間のPN接合が逆バイアスとなるようにした。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 圧力導入孔(2a)を有しその終端が薄 肉部(2b)となっているセンシングボディ部(2) と、このセンシングボディ部(2)の外側にあって被検 出体に取り付けられるハウジング部(1)とを有し、導 電性部材で構成されたボディ部材(1、2)と、

1

(5) を介して固定され、第1導電型の半導体基板 (4) 1) に第2導電型の歪ゲージ(42a~42d) が形成 されて構成されており、前記薄肉部(2b)の変位に応 10 じた電気信号を出力するセンサチップ(4)と、

前記薄肉部(2b)の圧力導入側と反対側に絶縁体

前記半導体基板(41)と前記歪ゲージ(42a~42 d) との間のPN接合が逆バイアスとなるように、前記 半導体基板(41)の電位を固定する電位固定手段(4 3 e、44、45,46) とを備えたことを特徴とする 圧力検出装置。

【請求項2】 前記半導体基板(41)はN型基板であ って、前記歪ゲージ(42a~42d)はブリッジ回路 を構成しており、前記電位固定手段は、前記ブリッジ回 路の電源回路(72)と前記半導体基板(41)とを電 20 気的に接続する手段(43e、44、45,46)であ ることを特徴とする請求項1に記載の圧力検出装置。

【請求項3】 前記電位固定手段は、前記歪みゲージ (42a~42d) の形成領域を取り囲むように形成さ れた第1導伝型の拡散層(45)を有して前記電位の固 定を行うものであることを特徴とする請求項1又は2に 記載の圧力検出装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、圧力を検出する圧 30 力検出装置に関し、例えば車両における燃料噴射装置の 燃料圧やブレーキ装置のブレーキオイル圧等の高圧を検 出するのに用いて好適なるものである。

[0002]

【従来の技術】従来、この種の圧力検出装置としては、 特開昭62-73131号公報に示されるものがある。 このものは、圧力導入孔の終端が薄肉部となっているセ ンシングボディをハウジング内に収納し、センシングボ ディの薄肉部に絶縁体を介して密着固定したセンサチッ プにより薄肉部の変位に応じた電気信号を出力するよう 40 にしている。また、センサチップは、半導体基板に歪ゲ ージを拡散形成した半導体式のものとなっている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記した構成において は、図10に示すように、センサチップを構成する半導 体基板101とセンシングボディ102は、その間に絶 縁体103が介在しているため電気的に絶縁されている が、半導体基板101、絶縁体102、センシングポデ ィ102は、コンデンサ104を形成する構造となって いる。このため、被検出体からハウジングを介してセン 50 近い材質のもの)で構成され、内側に圧力導入孔2aを

シングボディ102に高周波のノイズが侵入すると、コ ンデンサ104によって半導体基板101の電位にノイ ズが重畳し、歪ゲージに対してノイズが直接侵入するた め、センサの出力が変動するという問題がある。

【0004】本発明は上記問題に鑑みたもので、ノイズ による出力変動を低減することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、請求項1に記載の発明においては、センシングボデ ィ部(2)における薄肉部(2b)に絶縁体(5)を介 して固定されたセンサチップ(4)において、このセン サチップ(4)を構成する半導体基板(41)の電位を 固定して、半導体基板(41)と歪ゲージ(42a~4 2 d) との間のPN接合が逆バイアスとなるようにした ことを特徴としている。

【0006】従って、被検出体からハウジング部

(1)、センシングボディ部(2)、絶縁体(5)を介 して高周波ノイズが半導体基板 (41) に侵入しても、 歪ゲージ(42a~42d)へのノイズの影響を低減で き、出力変動を低減することができる。この場合、半導 体基板(41)をN型基板としたときには、半導体基板 (41) を電源電圧に固定することによって、半導体基 板(41)と歪ゲージ(42a~42d)との間のPN 接合が逆パイアスとなる。

【0007】また、請求項2に記載の発明においては、 歪ゲージ(42a~42d)により構成されるブリッジ 回路の電源回路(72)と半導体基板(41)とを電気 的に接続するようにしているから、電位固定のための余 分な電源回路を用いることなくノイズ低減のための構成 を実現することができる。また、上記した電位固定は、 請求項3に記載の発明のように、歪みゲージ(42a~ 42 d) の形成領域を取り囲むように形成された第1導 伝型の拡散層(45)を有して行うことができる。

【0008】なお、上記した括弧内の符号は、後述する 実施形態記載の具体的手段との対応関係を示すものであ る。

[0009]

【発明の実施の形態】以下、本発明を図に示す実施形態 について説明する。図1に、本発明の一実施形態を示す 圧力検出装置の断面構造を示す。この圧力検出装置は、 車両における燃料噴射装置の燃料圧やブレーキ装置のブ レーキオイル圧等の高圧(例えば20MPa)の流体の 圧力を測定するものである。

【0010】図において、ハウジング1は、耐食性が良 好で溶接可能な金属(例えばSUS430)で構成され ており、ねじ山1aを有し、図示しない被検出体 (例え ば、燃料配管) にねじ締めで固定されるようになってい る。センシングポディ2は、熱膨張率が小さい低熱膨張 率金属(例えばコパール等の線熱膨張係数がシリコンに

有し、その終端に受圧用ダイヤフラムをなす肉薄部2b が形成されている。図2に、センシングボディ2の外観 形状を示す。センシングボディ2は、円筒形状をしてお り、その端部すなわち下端開口周縁部には段差部2cが 形成されている。

【0011】このセンシングボディ2は、ハウジング1

の内側空洞部に圧入され、その段差部2 c とハウジング 1の開口縁(端部) 1 bとが突き合わされ、その部分が 電気溶接等によって密着固定される。このようにして、 センシングボディ2がハウジング1内に組付け固定さ れ、ボディ部が構成される。また、ハウジング1には、 ねじ山1 aの内側空洞部に段差部1 bが形成されててい るため、センシングボディ2がハウジング1内に組付け 固定されたとき、ハウジング1とセンシングボディ2の 間に、環状の隙間3が形成される。この隙間3により、 ハウジング1を被検出体に固定したときに生じる応力が センサチップ4に伝達するのを阻止することができる。 【0012】センシングボディ2における薄肉部2bの 上面、すなわち圧力導入側と反対側の面には、センサチ ップ4が、絶縁体である低融点ガラス5により接合され 20 ている。図3に、センシングボディ2の先端部分の断面 斜視図を示す。図に示すように、N型単結晶のシリコン 基板41に4つのP型の歪ゲージ42a~42dが形成 されてセンサチップ4が構成されており、薄肉部2bの 変位に応じた電気信号を出力する。

【0013】センシングボディ2の先端部の周囲には、 図1に示すように、回路基板7が配置されている。この 回路基板7は、センサチップ4からの電気信号を増幅し て出力する増幅回路(センサの感度調整を行う調整回路 を含む)などの回路部を有しており、積層セラミック基 板7a、回路チップ7b、およびポスト7cから構成さ れている。

【0014】積層セラミック基板7aは、表面及び内層 に導電性のペーストを印刷し焼成して形成されたもの で、接着剤によりハウジング1に固定されている。回路 チップ7bは、積層セラミック基板7a上に実装され、 ワイヤにより積層セラミック基板7aの導電性ペースト 焼成してなる導電体(配線の一部領域)と電気的に接続 されている。ポスト7cは、外部との電気接続を行うた めの取り出し電極となるもので、例えば42アロイにて 40 構成されており、ろう付け等によりセラミック積層基板 7 a 上に接合されている。

【0015】セラミック基板7aの表面の導電体とセン サチップ4とは、隙間3を跨いでワイヤ8により電気的 に接続されている。また、センシングボディ2および積 層セラミック基板7の上面(センサチップ4およびワイ ヤ8の上を含む)には、腐食防止のためにコーティング 材(例えばシリコーンゲル)9によりコーティングが施 されている。

ト7 c は、ターミナルアッセンブリ10のコネクタター ミナル10 aと電気溶接等で接続されている。このター ミナルアッセンブリ10は、コネクタターミナル10a をPPS等の樹脂でインサート成形したものである。そ して、ターミナルアッセンブリ10と、PPS等の樹脂 で成形されたコネクタケース11は、Oリング12を介 しハウジング1のかしめ部1dでハウジング1にかしめ 固定されている。

【0017】上記したセンサチップ4および回路基板7 10 における回路部の電気結線図を図4に示す。歪ゲージ4 2 a~42dは、図に示すようにように、ブリッジ回路 を構成している。回路基板7における回路部は、ブリッ ジ回路からの電気信号を増幅する増幅回路71の他、ブ リッジ回路に電源供給を行う電源回路72を有してい る。そして、歪ゲージ42a~42dにより構成される ブリッジ回路は、薄肉部2bに加わる圧力に応じた電気 信号を増幅回路71に出力し、増幅回路71は、その信 号を増幅して、圧力に応じた電気信号を外部に出力す

【0018】また、センサチップ4は、図5に示すよう に、シリコン基板41上に歪ゲージ42a~42dが不 純物拡散によって形成されている。また、シリコン基板 41上には絶縁膜が形成されており、この絶縁膜にはス ルーホールが形成され、このスルーホールを介して歪ゲ ージ42a~42dと外部との接続電極をなすパッド4 3 a~43dとがA1配線によって接続されている。な お、これらのパッド43a~43dは、ワイヤ8によっ て回路基板7上の増幅回路71、電源回路72に電気的 に接続されている。

【0019】ここで、本実施形態では、シリコン基板4 1の電位を電源電圧に固定するために基板接続用パッド 43 e が設けられ、このパッド43 e と電源回路72に 接続されたパッド43a間がAl配線44で接続されて いる。なお、基板接続用パッド43eは絶縁膜に形成さ れたスルーホールを介してシリコン基板41に電気的に 接続されている。

【0020】このように構成することによって、シリコ ン基板41の電位が電源回路72の電源電圧に固定さ れ、N型のシリコン基板41とP型の歪ゲージ42a~ 42dとの間のPN接合が逆バイアスされる。従って、 被検出体から導電性部材で構成されたハウジング1、セ ンシングボディ2を介し、さらに低融点ガラス5を介し て高周波ノイズがシリコン基板41に侵入しても、電源 回路72の高周波インピーダンスが十分に低ければ、シ リコン基板41に侵入したノイズは電源回路72に吸収 され、歪ゲージ42a~42dは安定的に電源電圧でバ イアスされる。

【0021】よって、高周波ノイズによる歪ゲージ42 a~42dへの影響を低減することができ、ひいてはセ 【0016】セラミック積層基板7aに接合されたポス 50 ンサ出力の変動を低減することができる。本発明者等が

実験により確認したところ、図1に示す圧力検出装置を 車両に取り付けてアイドリング状態にしたとき、シリコ ン基板41の電位を従来のようにフローティングにする と、センサ出力のノイズが244mV₁₋₁になり、本実 施形態のようにシリコン基板41を電源回路72に接続 すると、センサ出力のノイズが78mV。。になり、セ ンサ出力の変動を大きく低減することができた。

【0022】なお、上記実施形態では、歪ゲージ42a ~42dによるブリッジ回路の電源回路72とシリコン 基板41とを電気的に接続するものを示したが、図6に 10 示すように、ブリッジ回路の電源回路72とは別の電源 回路73(歪ゲージ42a~42dよりも電位が高く、 高周波インピーダンスが十分に低いもの) とシリコン基 板41とを電気的に接続するようにしてもよい。

【0023】また、上記実施形態では、基板接続用パッ ド43eを設けてN型のシリコン基板41の電位をセン サチップ4内の最高電位に固定するものを示したが、歪 ゲージ42a~42dが形成された領域をN'拡散層に よって囲み、そのN'拡散層の電位をセンサチップ4の 最高電位に固定するようにしてもよい。この場合の実施 20 形態を図7に示す。この図7は、センサチップ4を上か ら見た図で、N のシリコン基板41には、歪ゲージ4 2a~42dが形成された領域を取り囲むようにN' 拡 散層45が形成されおり、このN'拡散層45の上にA 1配線46が形成されている。そして、A1配線46と N'拡散層45とは、図7中のA-A断面である図8に 示すように、絶縁膜47に形成されたコンタクトホール 48 (図7中には点線で示す)を介して電気的に接続さ れている。なお、A1配線46は、歪ゲージ42a~4 2 dからパッド43b、43c、43dへのA1配線が 30 の図である。 形成された部分で途切れているが、その部分はその下の N' 拡散層45により電気的に小さな抵抗で接続されて いる。また、A1配線46は、電源回路72に接続され たパッド43aと電気的に接続されているため、センサ チップ4の最高電位に固定されている。

【0024】このように構成することにより、N のシ リコン基板41とP型の歪ゲージ42a~42dとの間 のPN接合が逆バイアスされるため、電気ノイズによる 歪ゲージ42a~42dへの影響を受け難くすることが できる。なお、この実施形態においても、図6に示すよ 40 路。

うに、ブリッジ回路の電源回路72とは別の電源回路7 3とN' 拡散層45とを電気的に接続するようにしても よい。

【0025】また、上記実施形態では、ハウジング1と センシングボディ2を別体にて構成するものを示した が、図9に示すように、ハウジング1とセンシングボデ ィ2を同一の導電性部材にて一体的に構成してもよい。 さらに、センサチップ4とセンシングボディ2との接合 は、低融点ガラス5以外の絶縁体による接合を用いても よい。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態にかかる圧力検出装置の断 面図である。

【図2】センシングボディ2の外観形状を示す図であ る。

【図3】センシングボディ2とセンサチップ4の構成を 示す部分断面斜視図である。

【図4】センサチップ4および回路基板7における回路 部の電気結線図である。

【図5】センサチップ4の模式的な構成を示す図であ

【図6】本発明の他の実施形態を示す電気結線図であ

【図7】本発明の他の実施形態にかかるセンサチップの 平面図である。

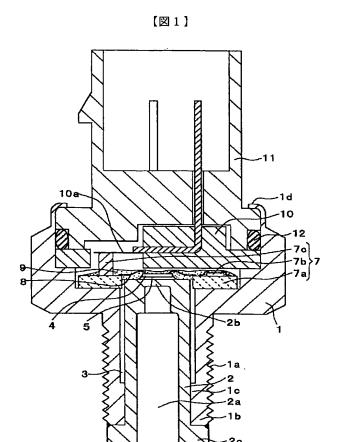
【図8】図8中のA-A断面図である。

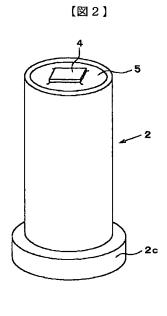
【図9】本発明の他の実施形態にかかる圧力検出装置の 断面図である。

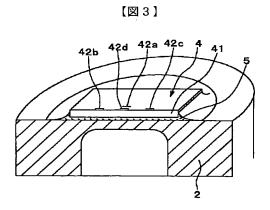
【図10】従来の圧力検出装置の問題点を説明するため

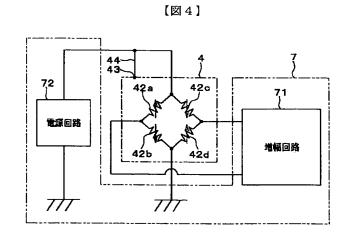
【符号の説明】

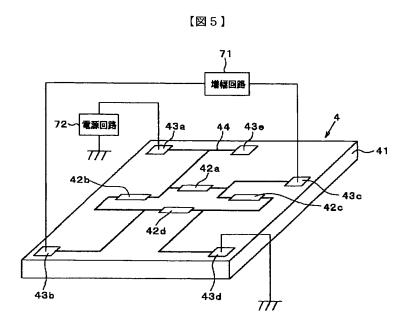
1 …ハウジング、2 …センシングボディ、2 a …圧力導 入孔、2b…肉薄部、3…隙間、4…センサチップ、4 1…シリコン基板、42a~42d…歪ゲージ、43a ~43d···パッド、45···N' 拡散層、46···A1配 線、5…低融点ガラス、 7…回路基板、8…ワイヤ、 9…コーティング材、10…ターミナルアッセンブリ、 10a…コネクタターミナル、11…コネクタケース、 12…〇リング、71…増幅回路、72、73…電源回

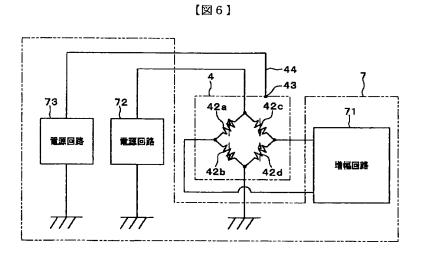


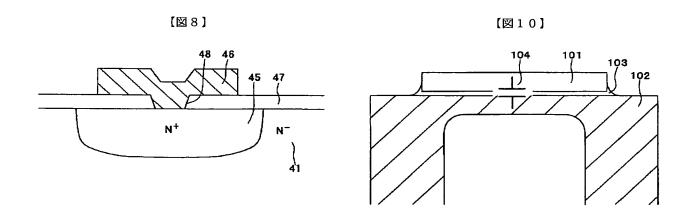












(図 7) (図 9) (Z 9)

